



## Sûreté de fonctionnement

Surchauffe du fi

#### **Objectifs**

- introduction des concepts fondamentaux de la SdF
- montrer à tout ingénieur que la défaillance d'un système n'est pas une fatalité et qu'il est souvent possible d'en évaluer sa probabilité

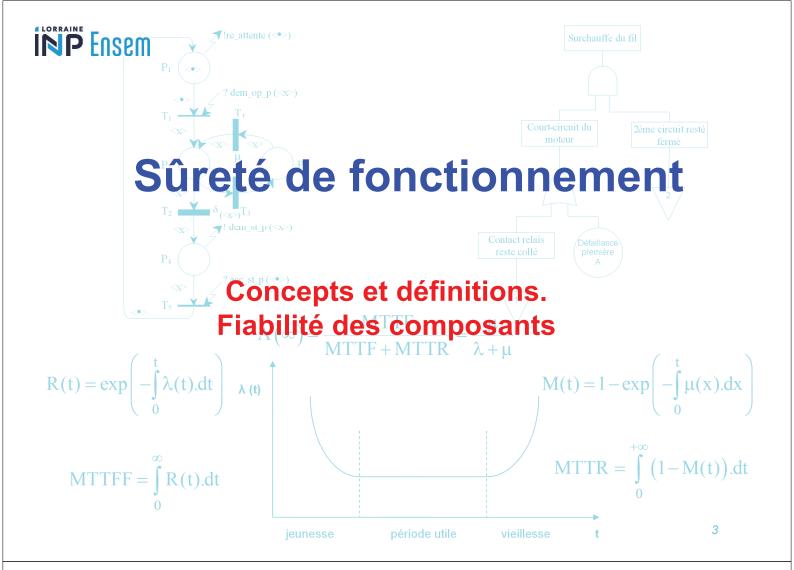
#### **Prérequis**

- probabilités et statistiques T
- théories et modèles des systèmes à événements discrets (SED): algèbre de Boole, modèles à états-transitions (automates à états finis, réseaux de Petri)

#### **Programme**

- concepts et définitions
- fiabilité des composants  $\Lambda(\infty) =$
- méthodes qualitatives de la SdF,: APR, AMDE, AMDEC, HAZOP, ...
- approches d'évaluation combinatoires : diagrammes de fiabilités, arbres des défaillances
- $M(t) = 1 \exp \left[ -\int_{0}^{t} \mu(x) . dx \right]$
- approches d'évaluation basées sur l'espace d'états : processus stochastiques (chaînes de Markov), réseaux de Petri stochastiques
- approches orientées simulation : les SAN (Stochastic Activity Networks)  $MTTR = \begin{pmatrix} 1 M(t) \end{pmatrix} dt$
- sécurité fonctionnelle et systèmes instrumentés de sécurité (SIS) norme IEC 61508, niveau SIL

#### Savoir-faire et compétences acquises



# Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

• au sens le plus large, la sûreté de fonctionnement (SdF, dependability) est

## LA « SCIENCE » DES <u>DEFAILLANCES</u>

- étapes :
  - identifier les défaillances et de manière aussi exhaustive que possible
  - ensuite pour chacune des défaillances, il conviendra d'en évaluer l'importance par rapport aux autres (on parlera de niveaux de risque) ou avec une échelle de mesure absolue (en calculant une probabilité d'apparition)
- **prévoir** les défaillances est aussi un objectif essentiel ; ainsi, on doit R(t) observer et utiliser des modèles d'évolution  $M(t) = 1 \exp\left(-\frac{\mu(x) \cdot dx}{\mu(x)}\right)$ 
  - à toute observation d'une défaillance, on associera des **mesures** (statistiques rendement) afin d'enrichir les modèles utilisés pour l'évaluation et la prévision  $MTTR = \begin{pmatrix} 1 M(t) \end{pmatrix} . dt$
  - enfin, l'ultime objectif est de **maîtriser** les défaillances par la réduction de leur occurrence, la prévention contre les conséquences ou par leur tolérance jeunesse période utile vieillesse t

## INP Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

Il existe des définitions plus strictes de la sûreté de fonctionnement, retenons celle-ci assez couramment utilisée et qui est proposée dans la norme du vocabulaire de la sûreté de fonctionnement [CEI 50 (191)]

## APTITUDE D'UNE ENTITE A ASSUMER UNE OU PLUSIEURS **FONCTIONS REQUISES DANS DES CONDITIONS DONNEES**

Cette notion très générale et non quantitative, peut être caractérisée par un certain nombre d'attributs : **MTTF** 

- entraves à la sûreté de fonctionnement TTR
- moyens d'obtention de la SdF
- moyens de validation
- mesures de la SdF

$$M(t) = 1 - \exp\left(-\int_{0}^{t} \mu(x).dx\right)$$

Afin de préciser l'extension de la sûreté de fonctionnement, il convient de définir avec précision certains mots apparus dans les définitions précédentes (mots soulignés). jeunesse

# INP Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

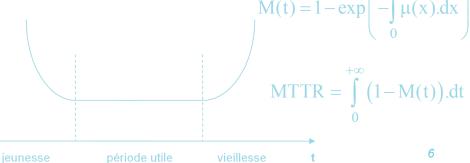
## Défaillance (Failure) Page 1

- C'est un **événement**. Un événement est présent ou non il peut se combiner avec d'autres événements pour produire des événements composés. Une partie de l'étude des défaillances relève donc du domaine de l'algèbre des événements et de la théorie des systèmes à événements discrets.
- une défaillance est : la cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise

Cela amène naturellement à la nécessité de définir la fonction et le critère de cessation de celle-ci et bien sûr à établir une classification des défaillances.  $R(t) = \exp \left| \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right|$ 

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

λ (t)



## INP Ensem Sûrété de fonctionnement. Définitions

## Entité (Item, entity) dem\_op\_p(SSE)

• Selon les mêmes références, une entité peut être considérée comme :

tout élément, composant, sous système, unité fonctionnelle, équipement ou système que l'on peut considérer individuellement

- une entité peut être constituée d'éléments matériels (technologies de toute nature), d'éléments immatériels (logiciels, calculs...), d'éléments vivants (plantes, bactéries...) et bien sûr d'hommes (opérateurs, utilisateurs...) ou de toute combinaison de ces éléments
- la SdF s'applique donc à de nombreux domaines ; électricité, électronique, contrôle-commande, thermo-hydraulique, mécanique, informatique, torganisation des entreprises...  $\frac{M(t) = 1 \exp{-\int \mu(x).dx} }{M(t) = 1 \exp{-\int \mu(x).dx} }$
- un ensemble d'entités peut aussi être considéré comme une entité

Exemple de classification à EDF :

 $MTTR = \int_{0}^{\infty} (1 - M(t)).dt$ 

pièce ⊂ composant ⊂ sous-système ⊂ système élémentaire ⊂ système 7

# Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

## Entité (Item, entity) dem\_op\_p (<x>)

- la frontière permettant de définir l'appartenance à tel ou tel niveau d'entité peut être définie différemment selon la connaissance interne que l'on a ou pas de l'entité
- les relations entre entités seront rigoureusement définies en termes de localisation, de connexions ou d'interdépendance, afin notamment de rechercher les conséquences de leur défaillances les une sur les autres ; chaque entité possède donc une interface qui défini ces relations

$$A(\infty) = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

$$R(t) = \exp\left(-\int_{0}^{t} \lambda(t).dt\right) \quad \lambda(t)$$

$$M(t) = 1 - \exp\left(-\int_{0}^{t} \mu(x).dx\right)$$

$$MTTF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

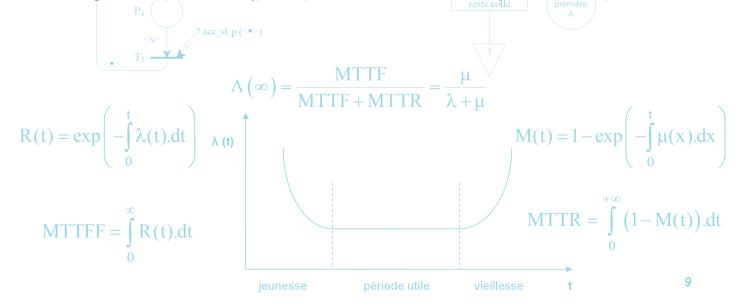
$$MTTR = \int_{0}^{+\infty} (1 - M(t)).dt$$

$$\text{jeunesse} \quad \text{période utile} \quad \text{vieillesse} \quad t$$

# INP Ensem Sûrété de fonctionnement. Définitions

#### Fonction requise

- fonction ou ensemble de fonctions d'une entité dont l'accomplissement est considéré comme nécessaire pour la fourniture d'un service donné
- on parle aussi de mission
- on caractérisera donc les fonctions ou missions d'une entité par leur nombre, leur degré d'importance (principales, secondaires dépendances



# INP Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

#### Fonction requise

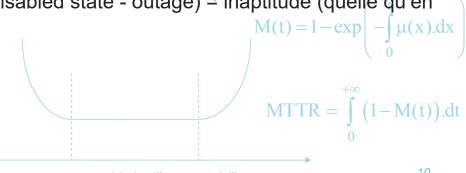
Relativement à sa (ses) fonction(s), on définit l'état d'une entité : 2ème circuit resté



- état de fonctionnement (operating state) 1.
- 2. état de non fonctionnement (non operating state)
- état de disponibilité (upstate) 3. cf. disponibilité
- état d'indisponibilité (downstate) (entretien, panne) 4.
- état d'attente (standby state) 5.
- état vacant (libre) idle (free) state 6.
- état d'incapacité (disabled state outage) = inaptitude (quelle qu'en

$$R(t) = \exp \left[ \int_{0}^{t} (raison)_{\lambda (t)} \right]$$

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$



# Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

#### Classification des défaillances

- il existe de nombreux critères de classification, en fonction de leur importance, de la rapidité de leur apparition, de l'instant de leur occurrence, de leurs causes, de leurs effets
- par la rapidité de manifestation :
  - défaillance progressive : due à l'évolution dans le temps des caractéristiques (on peut la prévoir)
  - défaillance soudaine : non prévisible.
- par l'importance :
  - défaillance partielle : il n'y a pas disparition de toutes les fonctions
- R(t) défaillance complète : inaptitude totale vis à vis de toutes les fonctions dx
  - défaillance pertinente : interprétation ou calculs
  - défaillance non pertinente : n'entraîne pas d'interprétation ou de calculs

$$MTTFF = \int_{0} R(t).dt$$

nesse pério

vieillesse

11

# Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

#### Classification des défaillances

- par la rapidité et l'importance :
  - défaillance catalectique : soudaine et complète
  - défaillance par dégradation : progressive et partielle (peut devenir complète)
- par le type de manifestation :
  - défaillance systématique : se produisant chaque fois que l'entité est mise dans les mêmes conditions
  - défaillance aléatoire : apparaissant de façon aléatoire lorsque l'entité se trouve dans un état de disponibilité  $MTTR = \lambda + \mu$
- par la date d'apparition :
  - défaillance précoce (ou de jeunesse) : le taux d'apparition baisse
  - défaillance par vieillissement (usure) : le taux d'apparition augmente

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

 $MTTR = \int_{0}^{\infty} (1 - M(t)).dt$ 

jeunesse période utile vieil

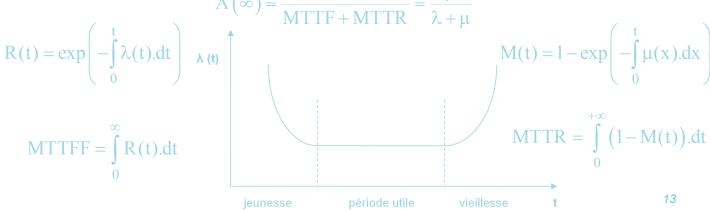
12

 $\mu(x).dx$ 

## INP Ensem Sûrété de fonctionnement. Définitions

#### Classification des défaillances

- par les effets :
  - défaillance mineure (bénigne) : dommage négligeable au système, pas de risque humain
  - défaillance significative : dommages significatifs au système, pas de risque humain
  - défaillance critique : dommages importants au système mais négligeables aux hommes ou à l'environnement
  - défaillance catastrophique : dommages importants au système, et aux hommes ou à l'environnement Γ μ



# Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

#### Classification des défaillances

- par les causes :
  - défaillance primaire (ou première) d'une entité : dont la cause directe ou indirecte n'est pas la défaillance d'une autre entité
  - défaillance secondaire (ou seconde) d'une entité : dont la cause directe ou indirecte est la défaillance d'une autre entité, l'entité devenant alors indisponible (nécessité de réparation) après disparition de la cause
  - défaillance par (de) commande d'une entité : dont la cause directe ou indirecte est la défaillance d'une autre entité, mais elle redevient disponible après disparition de la cause
- $R(t) = \exp \left| \lambda(t) \cdot dt \right|_{\lambda(t)}$   $M(t) = 1 \exp \left| \lambda(t) \cdot dt \right|_{\lambda(t)}$  Nécessité de rechercher les causes des défaillances.

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

$$MTTR = \int_{0}^{+\infty} (1 - M(t)).dt$$

jeunesse période utile

14

# INP Ensem Sûrété de fonctionnement. Définitions

#### Cause des défaillances (SE)

- la défaillance d'une entité est la conséquence de l'imperfection de celle-ci (imperfection intrinsèque ou due à celle de ses composants)
- une entité imparfaite est une entité qui contient des erreurs (ou imperfections)
- rechercher les causes de défaillance d'une entité, c'est donc chercher les causes de la présence de ces erreurs
- les erreurs peuvent être dues à de nombreuses causes :
  - faute de conception ou d'utilisation : les défaillances systématiques des logiciels dues à des erreurs de spécification, de conception ...
  - action de l'environnement TF + MTTR
- $R(t) = \exp \left( \frac{d^2 d^2}{dt^2} \right) = \exp \left( \frac{$
- ces causes peuvent être :
  - accidentelles
  - intentionnelles
    - permanentes
    - temporaires



# INP Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

jeunesse

#### Cause des défaillances

- l'action de l'environnement, ou d'un sous ensemble est comparable à celle du concepteur ou de l'utilisateur → le terme de FAUTE peut donc être généralisé (l'intérêt de cette notion est de mieux correspondre à l'anglais FAULT que le terme français « panne »)
- le schéma suivant caractérise le processus d'apparition des défaillances :

#### FAUTE -> ERREUR -> DEFAILLANCE

Un ingénieur commet une faute dans la conception d'un composant. Lorsque le composant est inséré dans un système, il y a alors présence d'une erreur qui produira une défaillance du composant à la sollicitation. Cette défaillance peut alors être considérée comme l'injection d'une faute dans le système qui contient ce composant qui recèle alors lui-même une erreur qui entraînera à son tour le moment venu une défaillance du système.

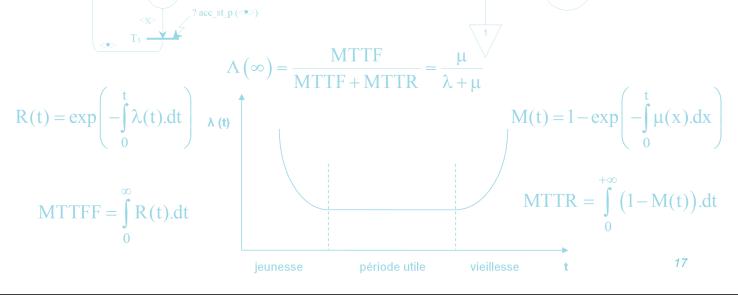
• faute et défaillance sont des événements, erreur est un état ; on parle M(t) de des événements, erreur est un état ; on parle M(t)généralement de latence d'erreur pour la durée de cet état

## INP Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

#### Cause des défaillances (SE)

• la notion de PANNE est souvent présentée comme l'état de l'entité après l'apparition de sa défaillance ; c'est une conséquence de sa défaillance (à rapprocher plutôt de l'état d'indisponibilité définissant la panne comme l'inaptitude d'une entité à accomplir une fonction requise).

On voit pourquoi il y a souvent assimilation de faute + erreur avec panne.



# ÎNP Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

#### Classification des fautes

- on peut classifier les fautes :
  - -Accidentelle
  - Physique
  - Interne
  - Active (qui produit une erreur)
  - Douce

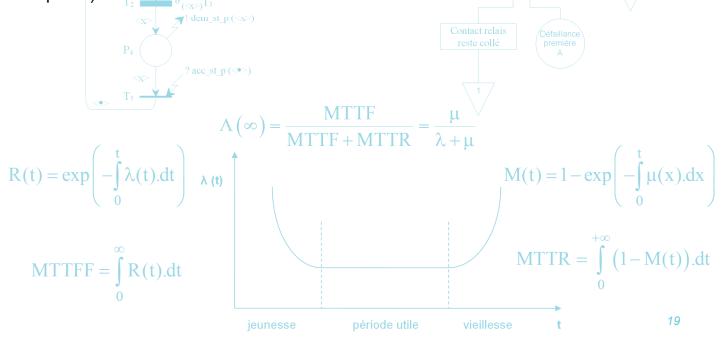
  - Permanente

- Intentionnelle
- Humaine
- Externe
- Dormante (qui ne produit pas d'erreur
- Dure
- Temporaire (transitoire)
- Opérationnelle, ou par opposition : de conception
- $R(t) = \exp \left[ \left| \lambda(t) . dt \right| \right]_{\lambda(t)}$  certaines de ces classes peuvent être subdivisées, de plus, elles ne s'excluent pas forcément
- par exemple, une erreur humaine peut être de conception, de fabrication ou d'utilisation (mauvais emploi, fausse manœuvre, etc.)

## INP Ensem Sûrété de fonctionnement. Définitions

#### Classification des fautes

Remarque: Lorsque la notion de panne est utilisée de préférence aux notions d'erreur et de fautes, les pannes reçoivent alors les qualificatifs que nous avons attribué aux fautes ou aux défaillances (défaillance complète > panne complète).



# Ensem Sûreté de fonctionnement. Définitions

En résumé, la sûreté de fonctionnement peut être vue comme étant le traitement des fautes (s'attaquer aux sources des défaillances) ; elle regroupe les activités de :

- prévention des fautes : consiste à prévenir le concepteur, le fabricant, l'utilisateur, l'opérateur, le consommateur contre le risque lié aux diverses activités associées à une entité
- tolérance aux fautes : consiste à doter le système des moyens nécessaires à la continuité de la fonction ou du service en présence d'une faute (par la redondance en général)
- élimination des fautes A consiste à détecter la présence d'une faute avant qu'elle ne se manifeste par un danger et à la supprimer (réparation, the Rmaintenance, modification, reconception...),  $M(t) = 1 \exp(-\int \mu(x) dx)$
- prévision des fautes : consiste à prévoir l'occurrence de défaillances liées à la présence des fautes dans un système, en particulier par le calcul probabiliste qui permet d'évaluer le risque conséquent  $MTTFF = \int_{-\infty}^{\infty} (1-M(t)) dt$

## INP Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

#### Fiabilité (reliability) dem\_op\_p (SSE)

- à l'origine (1960) la fiabilité était à elle seule la sciences des défaillances
- traduction de l'anglais « reliability », ce mot (entré au dictionnaire en 1962) a été construit à partir du mot « fiable » : en qui on peut se fier

## **Définition**

Aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise dans des conditions données, pendant une durée donnée.

## **€** Mesure

La fiabilité se mesure par la probabilité qu'entité E accomplisse une fonction requise dans les conditions données pendant l'intervalle de temps [0,t] (ou encore [t1,t2] comme dans la norme CEI 50(191)).

R(t) = P[E soit non défaillante sur [0,t]]

R(t1,t2) = P[E] soit non défaillante sur [t1,t2] (1-M(t)) dt

L'aptitude contraire 1 - R(t) est la probabilité de défaillance de l'entité quelquefois appelée défiabilité.

# INP Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

#### Fiabilité (reliability) dem\_op\_p (SSE)

## **E** Evaluation

L'évaluation de cette probabilité peut être faite différemment selon la nature des entités considérées ou selon les moyens dont on dispose pour le faire.

- la fiabilité opérationnelle (observée) résulte de l'observation et de l'analyse du comportement d'entités identiques dans des conditions opérationnelles
- la fiabilité extrapolée qui résulte d'une extension (par extrapolation définie ou par interpolation) de la fiabilité opérationnelle à des durées ou des conditions différentes
- la fiabilité prévisionnelle (prédite) qui estime une fiabilité future d'une entité à partir de considérations sur la conception de cette entité et la fiabilité de ses composants. La fiabilité prévisionnelle fera l'objet de plusieurs chapitres de ce cours.
- la fiabilité intrinsèque est mesurée au cours d'essais spécifiques sur l'entité, effectués dans le cadre d'un programme d'essais entièrement défini

22

# Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

## Mainténabilité (maintenability)



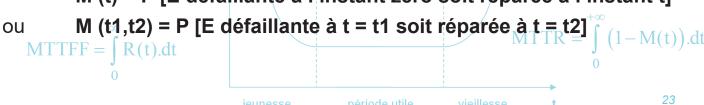
Aptitude d'une entité à être maintenue ou rétablie dans un état dans lequel elle peut accomplir une fonction requise lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données avec des procédures et des moyens prescrits.

## Mesure

La maintenabilité se mesure par la probabilité que la maintenance d'une entité E, assurée dans des conditions données et avec des moyens et des procédures présents, s'achève à l'instant t, sachant que l'entité est défaillante

à l'instant 
$$t = 0$$
  
 $R(t) = \exp \left(-\int_{0}^{t} \lambda(t) dt\right)$ 
 $\lambda(t)$ 

M (t) = P [E défaillante à l'instant zéro soit réparée à l'instant t]

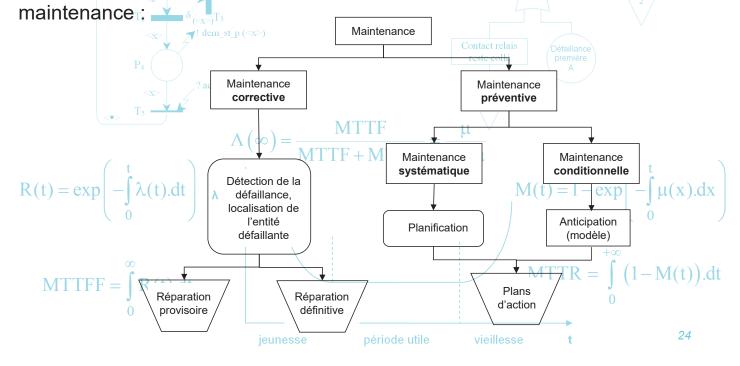


# Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

## Mainténabilité (maintenability)

## **E** Evaluation

L'évaluation de cette probabilité est liée à la manière dont est effectuée la remise en état de fonctionnement de l'entité. Il existe différents types de



# Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

## Mainténabilité (maintenability)

## **E** Evaluation

moteur

2ème circuit resté
fermé

- la maintenance corrective intervient après la défaillance constatée de l'entité
- la maintenance différée consiste à retarder la réparation des entités qui ne mettent pas en jeu le fonctionnement optimal d'un système constitué de multiples entités (pour attendre par exemple le prochain arrêt)
- la maintenance préventive programmée ou non programmée des entités les plus critiques consiste à les réparer (voire les remplacer) dès qu'elles manifestent des signes de fatigue, c'est la maintenance conditionnelle, ou dès que leur fiabilité estimée devient insuffisante, c'est la maintenance systématique

La politique de maintenance adoptée, son éventuelle optimisation selon différents critères (disponibilité, coût, stocks de rechange...), ont un impact direct sur la sûreté de fonctionnement globale d'un système

La terminologie de la maintenance est définie dans différentes normes comme par exemple les normes françaises NF X60-000, NF X60-010, NF X60-011, NF X60-015 et NF X60-020.

## INP Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

## Disponibilité (Availability)



C'est l'aptitude d'une entité à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données et à un instant donné.



La disponibilité se mesure par la probabilité qu'une entité E soit en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données à l'instant t

## A (t) = P [entité non défaillante à l'instant t]

- cette caractéristique est appelée disponibilité instantanée
- · la notion contraire est appelée indisponibilité (unavailability) notée U(t) dx
- la disponibilité ainsi définie ne fait pas appel à l'histoire de l'entité, qu'elle ait été ou non réparée une ou plusieurs fois avant l'instant t (c'est en quelque sorte une probabilité non conditionnelle)  $MTTR = \begin{cases}
  (1-M(t)) & \text{otherwise} \\
  (1-M(t)) & \text{otherwise}
  \end{cases}$
- est donc évident que pour un système non réparable, la disponibilité est égale à la fiabilité, et que d'une manière générale A (t) ≥ R (t)

## INP Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

## Sécurité (safety)

## Définition ○

La norme CEI 50 (191) n'intègre pas la sécurité comme composante de la sûreté de fonctionnement qu'elle restreint aux seules fiabilité, maintenabilité et disponibilité (FMD ou en anglais RAM).

La norme EN 292 sur la sécurité des machines donne cette définition :

« Aptitude d'une machine à accomplir sa fonction, à être transportée, installée, mise au point, entretenue, démontée et mise au rebut dans les conditions d'utilisation normales spécifiées dans la notice d'instructions, sans causer de lésions ou d'atteinte à la santé. »

Selon les lois, la sécurité s'applique aux risques d'atteinte physique aux (x) dx personnes et plus récemment aux atteintes à l'environnement. Selon l'IEC 61508, la sécurité est définie par l'absence de risque inacceptable.

C'est la sécurité des personnes, en anglais « safety ».  $MTTR = \int (1-M(t)) dt$ 

On constate une certaine ambiguïté entre les mots sécurité et sûreté en français d'une part et les mots safety et security en anglais d'autre part.

## Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

## Sécurité (safety)

C'est pourquoi en français, on parle de « Sécurité innocuité » (safety) aptitude d'une entité à éviter de faire apparaître des événements critiques ou catastrophiques c.à.d. pouvant affecter les personnels et les équipements. Une telle entité est dite à sûreté intégrée ou de sécurité intrinsèque (fail safe).

## **№** Définition

Le terme anglais « security » correspond pour [Laprie] à la « sécurité confidentialité » à aptitude d'une entité à la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des informations.

$$R(t) = \exp\left(-\int_{0}^{t} \lambda(t).dt\right) \qquad MTTF + MTTR \qquad \lambda + \mu$$

$$M(t) = 1 - \exp\left(-\int_{0}^{t} \mu(x).dx\right)$$

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

$$MTTF = \int_{0}^{+\infty} (1 - M(t)).dt$$

$$\text{jeunesse} \qquad \text{période utile} \qquad \text{vieillesse} \qquad t$$

# INP Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

## Sécurité (safety)



La sécurité-innocuité

- Court-circuit du 2ème circuit rest moteur fermé
- doit vérifier que le comportement du système respecte toutes les exigences de sécurité (empêcher des comportements dangereux ou illégaux, *e.g.* une sollicitation du système de commande ne peut pas avoir lieu dans un état incompatible avec cette commande)
- peut également s'exprimer sous forme d'une probabilité d'évitement d'une situation dangereuse ou catastrophique (la sécurité fonctionnelle par exemple doit être évaluée quantitativement par la probabilité de défaillance dangereuse d'un système chargé d'assurer une fonction de sécurité sur  $\frac{M(t)=1-\exp{\left[-\frac{\mu(x).dx}{\mu(x)}\right]}}{M(t)}$

## **E** Evaluation

- les exigences de sécurité sont évaluées qualitativement par des méthodes formelles R(t) dt R(t)
- la probabilité d'évitement d'une situation dangereuse est évaluée quantitativement par des approches stochastiques

# INP Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

#### Sécurité (safety)

Par rapport à la sécurité-innocuité les défaillances peuvent être classifiées en :

- défaillances sûres (safe failures) qui n'entraînent pas des dommages critiques ou catastrophiques pour l'homme ou pour l'environnement
- défaillances dangereuses (dangerous failures) qui entraînent des dommages critiques ou catastrophiques pour l'homme ou pour l'environnement

D.p.d.v. du diagnostic les défaillances peuvent être classifiées en :

- défaillances détectées qui peuvent être détectées par un système de diagnostic
- défaillances non-détectées qui ne peuvent pas être détectées (absence d'un système de diagnostic ou impossibilité physique ou technique de détection)

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

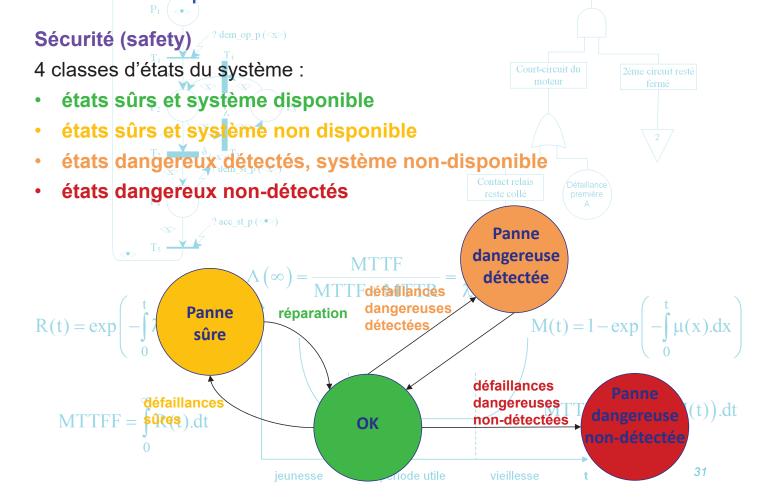
 $MTTR = \int_{0}^{\infty} (1 - M(t)).dt$ 

30

29

esse période utile vieille

# Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement



# Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

## Sécurité (safety) / ? dem\_op\_p (

les exigences de sécurité doivent montrer formellement qu'aucun état de panne dangereuse n'est atteignable (les croix rouges traduisent les transitions dont il est nécessaire de prouver l'inexistence) soit par l'action d'un système instrumenté de sécurité (SIS - Safety Instrumented System) après détection d'une défaillance dangereuse, soit par rendre impossible des défaillances dangereuses non-détectées (par ré-conception, par exemple)

la probabilité de ne pas attendre un état dangereux s'évalue comme *la probabilité* de rester dans les états sûrs (états « OK » ou de panne sûre)

 $\frac{\text{défaillances}}{\text{sûres}}$   $\frac{\mu}{\lambda + \mu}$   $M(t) = 1 - \exp\left[-\frac{t}{\mu(x) \cdot dx}\right]$   $\frac{\text{défaillances}}{\text{défaillances}}$   $\frac{\text{défaillances}}{\text{détectées}}$   $\frac{\text{défaillances}}{\text{défaillances}}$   $\frac{\text{défaillances}}{\text{défaillances}}$ 

défaillar

réparation

Panne

Panne dangereuse

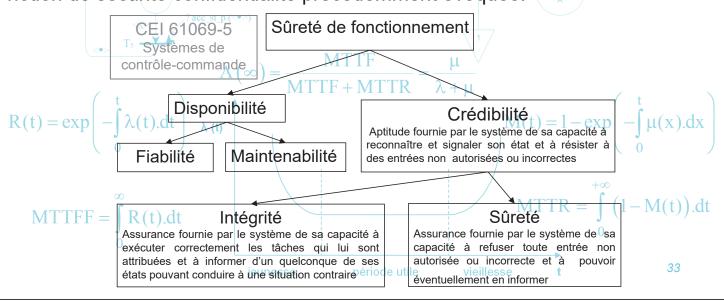
défaillances

## INP Ensencomposantes de la sûreté de fonctionnement

## Intégrité, crédibilité (mop.p.(SS))

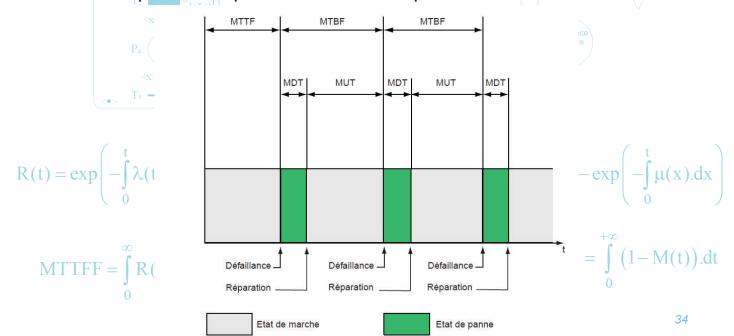


La norme 61069-1 partie 5 relative aux systèmes de contrôle-commande des installations industrielles, donne les mêmes définitions de la FMD, mais considère que la sûreté de fonctionnement dépend aussi de la crédibilité, ellemême décomposée en intégrité et sûreté, cette dernière se rapprochant de la notion de sécurité confidentialité précédemment évoquée.



# INP Ensem Les temps caractéristiques pour la SdF

- les grandeurs caractérisant la SdF sont d'abord les durées de fonctionnement: avant défaillance, entre défaillances, entre défaillance et réparation, etc...
- ces temps dépendent des probabilités d'occurrences des divers événements défaillances, réparations, ce sont des variables aléatoires que l'on cherche à caractériser par leur espérance mathématique



# INP Ensem Les temps caractéristiques pour la SdF

- MTTFF (mean time to first failure) ou MTTF (mean time to failure) : durée moyenne de fonctionnement avant la première défaillance, espérance mathématique de la durée de fonctionnement avant la première défaillance
- MTBF (mean time between failures) : durée moyenne entre deux défaillances consécutives d'une entité réparable
- MUT (mean up time) ou TMD (temps moyen de disponibilité) : durée moyenne de bon fonctionnement après réparation, espérance mathématique de la durée de disponibilité
- MDT (mean down time) ou TMI (temps moyen d'indisponibilité) : durée moyenne de défaillance comprenant la détection de la panne, la durée d'intervention, la durée de la réparation et la durée de la remise en service, Respérance mathématique de la durée d'indisponibilité  $M(t) = 1 \exp(-\int \mu(x) dx)$

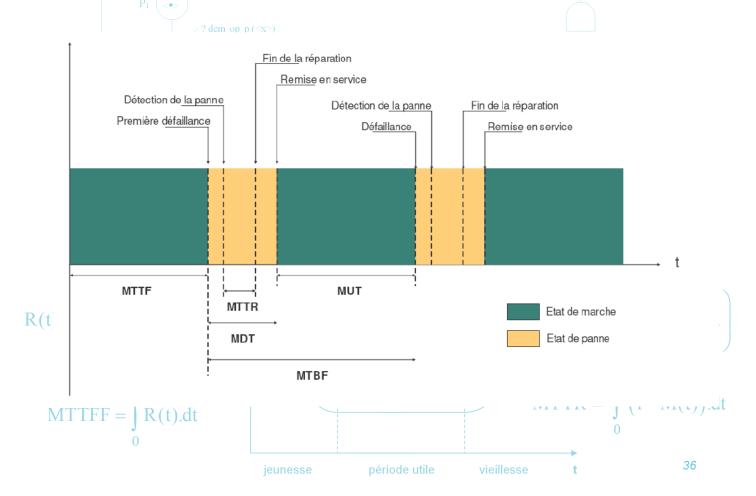
• MTTR (mean time to repair) : durée moyenne de la panne ou moyenne des temps pour la remise en état de fonctionnement, espérance mathématique de la durée de panne

jeunesse Nicolae Brîpzej o ENSEM vieillesse

35

INP Ensem Les temps caractéristiques pour la SdF

MTTFF = |R(t).dt



# INP Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## Fonction de répartition (SS)

Soit T la variable aléatoire mesurant la durée de fonctionnement de l'entité avant défaillance (on dit parfois durée de vie mais cela ne s'applique qu'aux entités non réparables).

La fonction de répartition de T s'écrit : F(t) = P(To≤t)ais reste collé

avec  $\lim_{t\to 0} F(t) = 0$  et  $\lim_{t\to \infty} F(t) = 1$   $\Lambda(\infty) = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$  Or par définition :  $R(t) = \exp(t) \neq P(T^t > t) \text{ (t)} \text{ (rappel : probabilité pour que l'entité soit non } \int_0^t \mu(x) dx$  défaillante sur [0,t]) défaillante sur [0,t])

→  $F(t) = 1 - R(t) = \overline{R}(t)$  et R(0)=1,  $R(\infty)=0$ 

La fonction de répartition de T est égale à la probabilité de défaillance ou la défiabilité de l'entité.

 $MTTFF = \int R(t).dt$ 

jeunesse

période utile

vieillesse

vieillesse

# INP Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

#### Densité de probabilité ou fonction de distribution

La densité de probabilité f(t) de la variable continue T ou encore fonction de distribution est définie par la relation :

 $F(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) du = 0$  F(t) est sa fonction de répartition

D'après la norme, d'une manière générale :

 $f(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta (\infty) \Delta t}$ 

La densité de probabilité de défaillance de l'entité (plus exactement de la variable T) est la dérivée de la fonction de répartition F(t) dans les domaines où elle est continue:

 $\frac{f(t)}{MTTFF} = \int_{R}^{\infty} \frac{dF(t)}{dt} = \frac{d\overline{R}(t)}{dt} = \frac{dR(t)}{dt} \qquad \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(u).du}{MTTR} = \int_{-\infty}^{\infty} (1 - M(t)).dt$ 

f(t) dt est la probabilité que la défaillance de l'entité intervienne entre t et t + dt

 $f(t) \cdot dt = P [t < \overline{p} \cdot \underline{s} \cdot t + dt]$ 

# INP Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

#### Taux instantané de défaillance

Contrairement à la densité de probabilité de défaillance (qui correspond à une probabilité à priori), le taux de défaillance s'apparente à la probabilité conditionnelle de défaillance sur ]t, t+ dt] sachant que l'entité n'a pas de défaillance sur [0,t].

## Définition (selon [CEI 50 (191)])

On appelle taux instantané de défaillance la limite, si elle existe, du quotient de la probabilité conditionnelle pour que l'instant T de défaillance d'une entité, soit compris dans l'intervalle de temps [t, t+ $\Delta$ t], par la durée  $\Delta$ t de l'intervalle de temps lorsque celui-ci tend vers zéro, en supposant que l'entité n'a pas eu de défaillance sur [0,t].

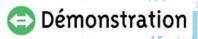
$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} P[t < T \le t + \Delta t / T > t]$$

## Conséquence

Cela signifie que λ(t) dt est la probabilité conditionnelle de défaillance sur [t, t + dt] sachant que l'entité n'a pas eu de défaillance sur [0,t].

# INP Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

#### Taux instantané de défaillance



Etablissons les relations entre  $\lambda(t)$ , R(t) et f(t) :

D'après le théorème des probabilités conditionnelles, on a donc :

$$\lambda(t).dt = \frac{P[(t^p < T \le t + dt) \cap (T > t)]}{P[T > t]}$$
Contact relais reste collé
$$P[T > t]$$

T > t étant inclut dans l'événement t < T < t + dt, et P[T > t] étant la définition de R(t), on a :  $\Lambda(\infty) = \frac{1}{MTTF} = \frac{\mu}{MTTF}$ 

R(t), on a: 
$$A(\infty) = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

$$R(t) = \exp\left(\lambda \int_{0}^{t} (t) dt dt\right) = \frac{P[t < T \le t + dt]}{\lambda (t)}$$
or: 
$$P[t < T \le t + dt] = f(t) dt$$

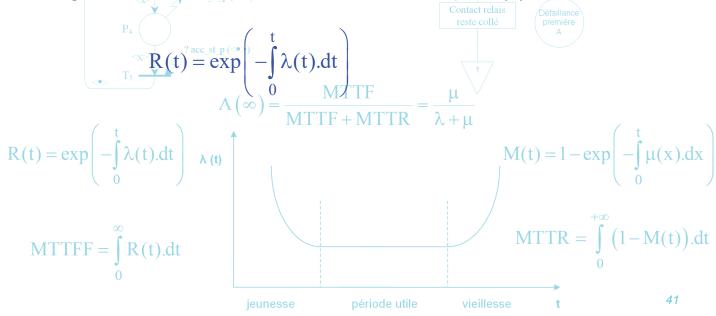
f(t) étant la fonction de distribution ou densité de probabilité

# Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## Taux instantané de défaillance

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda(t) = -\frac{d}{dt} \left( \log(R(t)) \right)$$

En intégrant les deux membres de 0 à t, sachant que R(0) = 1:



# Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## Evaluation statistique de R (t), f(t) et $\lambda(t)$

- considérons maintenant une population de N<sub>0</sub> entités ayant la même fonction de distribution des instants de défaillance
- la variable aléatoire discrète N(t), nombre d'entités non défaillantes à l'instant t, possède une distribution binomiale. (N<sub>0</sub> est le nombre d'épreuves, une épreuve est la non-apparition de la défaillance d'une entité à l'instant t avec la probabilité R(t) ou l'apparition d'une défaillance à ce même instant avec la probabilité 1-R(t))

$$P[N(t) = n] = C_{N_0}^n \left(R(t)\right)_{MT}^n \left(1_F R(t)\right)_{\mu}^{N_0 - n}$$

$$Soit: P[N(t) = n] = \frac{N_0 MTTF + MTTR}{N_0 MTTF + MTTR} \left(R(t)\right)_{n}^{N_0 - n} - \left(1 - R(t)\right)_{M(t) = 1 - \exp\left(-\frac{t}{n}\mu(x).dx\right)}$$

$$R(t) = \exp\left(-\frac{t}{n}\mu(x).dx\right)$$

N(t) a pour espérance mathématique (moyenne) que nous noterons n(t)

$$E(N(t)) = n(t) = N_0 R(t)$$

$$MTTFF \text{ on a donc}: \qquad R(t) = \frac{n(t)}{N_0} \qquad MTTR = \int_0^{+\infty} (1 - M(t)) . dt$$

On montre ainsi que la fiabilité est le rapport du nombre moyen d'entités non défaillantes au temps tesur le nombre initial d'entités.

42

# INP Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

#### MTTF et fiabilité / ? dem\_op\_p (<>>)

T étant défini comme la durée de fonctionnement avant défaillance, le MTTFF de l'entité correspondante est donc son espérance mathématique :

$$MTTFF = \int_{T_2}^{+\infty} t.f(t).dt$$

la variable t étant toujours positive, l'intervalle d'intégration est réduit à [0, +∞(

$$\frac{P_{4}}{MTTFF} = \int_{0}^{+\infty} t \cdot \frac{dR(t)}{dt} \cdot dt$$

que l'on peut intégrer par parties  $TTF + MTTR = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$ 

$$R(t) = \exp\left[-\int_{0}^{t} MTTFF \stackrel{+\infty}{=} \stackrel{+\infty}{=} R(t).dt - \begin{bmatrix} t.R(t) \end{bmatrix}_{0}^{\infty} \right]$$

$$pour t = 0:$$

$$M(t) = 1 - \exp\left[-\int_{0}^{t} \mu(x).dx - \int_{0}^{t} \lambda(x).dx - \int_{0}^{t} \lambda(x).d$$

# Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

#### MTTF et fiabilité

Si on sait calculer la transformée de Laplace R(s) de R(t) ralors : 2ème circuit resté

$$L \begin{bmatrix} \int_{0}^{t^{2}} R(x) dx \\ \int_{0}^{t} R(s) dx \end{bmatrix} = \frac{R(s)}{s}$$

d'après le théorème de la valeur finale :

$$MTTF = \lim_{t \to \infty} \int_{0}^{t} R(x) . dx = \lim_{t \to 0} \int_{0}^{t} R$$

$$R(t) = \exp \left( \frac{1}{2} \mathbf{F}(\mathbf{s}) \cdot \lim_{s \to \mathbf{0}} \mathbf{R}(\mathbf{s}) \right)$$

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

$$MTTR = \int_{0}^{+\infty} (1 - M(t)).dt$$

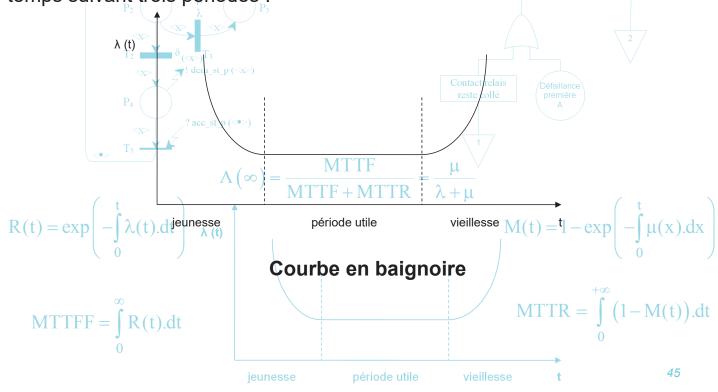
0

sse période utile

# Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

#### Application aux principales lois de probabilité

Généralement, la loi de variation du taux de défaillance  $\lambda(t)$  évolue dans le temps suivant trois périodes :



# Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## Application aux principales lois de probabilité

- La période de jeunesse où  $\lambda(t)$  diminue très rapidement avec t. Pour garantir un niveau de fiabilité suffisant, un fabriquant de matériels est souvent amené à vieillir artificiellement ses matériels avant de les livrer. C'est par exemple le « déverminage » (ou « burn-in ») des produits électroniques (fonctionnement accéléré aux limites des grandeurs d'influence : température, hygrométrie, vibrations...).
- La période utile où λ(t) varie peu.
- La période de vieillesse où λ(t) augmente de plus en plus vite avec t avant ou au début de laquelle il convient de remplacer le composant âgé par  $M(t) = 1 - \exp$ un composant neuf (maintenance préventive).

Le problème posé aux fiabilistes est donc d'abord de modéliser chacune de ces phases par des lois de probabilité connues. La plupart des lois de M(t) de probabilité sont utilisées en fiabilité pour modéliser  $\lambda(t)$  et calculer les MTTF.

## Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## Application aux principales lois de probabilité

## La loi exponentielle

La loi exponentielle représente correctement la distribution des durées de vie lorsque :

- les défaillances sont indépendantes et imprévisibles, et dont la génération obéit à un processus de Poisson et relais
- le taux de défaillance est constant et égal à λ.

C'est le cas des composants électroniques en période utile de fonctionnement. Cette loi est caractérisée par les relations suivantes :

$$\lambda(t) = \lambda = \text{constante}$$

$$R(t) = \exp \left[-\int_{-\lambda}^{\lambda} \lambda(t) dt\right]$$

$$F(t)_{0} = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$R(t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}$$

$$R(t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}$$

$$R(t) = \frac{\lambda}{dt} = \frac{\lambda}{dt} e^{-\lambda t}$$

$$R(t) = \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda} dt = \frac{1}{\lambda} e^$$

Ce modèle est le plus utilisé car il permet une simplification pour le calcul de la fiabilité de systèmes composés de nombreuses entités différentes.

En outre, le passé de tels systèmes n'affecte pas leur évolution futuré?

# Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

# Application aux principales lois de probabilité La loi exponentielle 2.5 f(t), F(t), $\lambda = 2$ f(t), F(t), $\lambda = 2$ f(t), f(t),

## PEnsem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

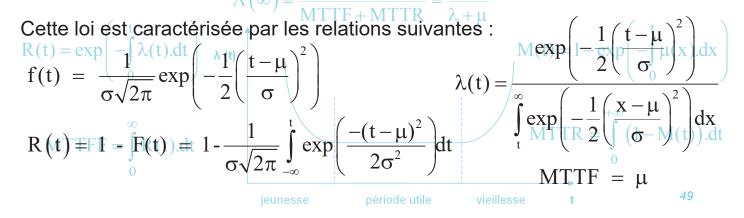
## Application aux principales lois de probabilité

#### La loi normale

Elle convient aux composants usés dont le taux de défaillance augmente avec t.

En effet, cette loi s'applique pour des systèmes dont les caractéristiques fonctionnelles sont altérées par un nombre important de causes indépendantes agissant de manière additive.

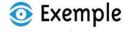
C'est le cas par exemple pour les durées de vie liées à l'usure de matériels mécaniques, nombre de charges/décharges supportables par des accumulateurs...



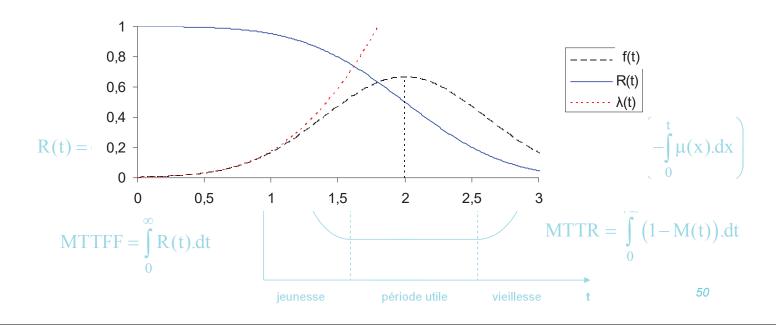
# INP Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## Application aux principales lois de probabilité

#### La loi normale



$$f(t)$$
,  $F(t)$ ,  $\lambda(t)$  pour  $\mu = 2$  et  $\sigma = 0.6$ 



# PEnsem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## Application aux principales lois de probabilité

## La loi log-normale

Elle s'applique pour des systèmes dont les caractéristiques fonctionnelles sont influencées par un nombre important de facteurs indépendants agissant de manière multiplicative.

Cette loi s'applique particulièrement au cas de la durée de vie des matériaux travaillant en fatigue sous l'action répétée de contraintes mécaniques ou à la durée de vie de composants optoélectroniques tels que les diodes laser (en rapport avec la réduction progressive du pouvoir émissif).

Cette loi est caractérisée par les relations suivantes :

$$R(t) = \exp\left(-\int_{0}^{\infty} \lambda(t) dt\right)$$

$$f(t) = \frac{1}{\sigma t \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\int_{0}^{\infty} \frac{1}{\sigma^{2}} (\log t - \mu)^{2}\right)$$

$$R(t) = \int_{0}^{\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right)$$

$$R(t) = \int_{0}^{\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{t} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}} dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}} dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}} dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}} dt$$

$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}} dt$$

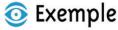
$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}} dt$$

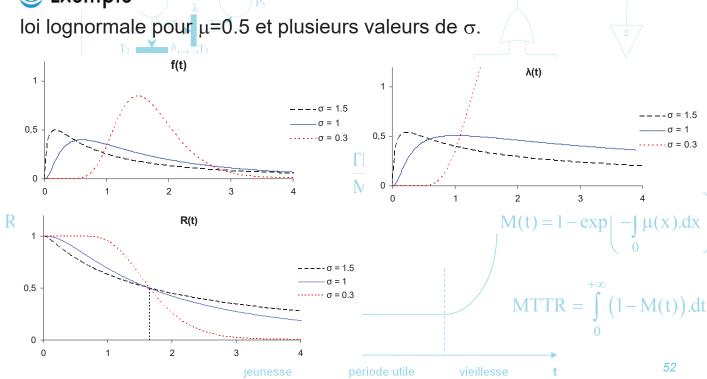
$$\int_{0}^{+\infty} -RF(t) = 1 - \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \frac{(\log t - \mu)^{2}}{\sigma^{2}}$$

## INP Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

#### Application aux principales lois de probabilité

#### La loi log-normale

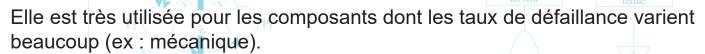




## PEnsem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## Application aux principales lois de probabilité

#### La loi de Weibull



Cette loi est caractérisée par la relation suivante :

$$f(t) = \frac{\beta (t - \gamma)^{\beta - 1}}{\eta^{\beta}} \exp \left(-\left(\frac{t - \gamma}{\eta}\right)^{\beta}\right)$$

- pour  $\beta$  < 1, le taux de défaillance est décroissant avec le temps (rodage, pannes de jeunesse)  $M(t) = 1 \exp\left(-\int_{-\infty}^{\infty} \mu(x) dx\right)$
- pour  $\beta$  = 1, le taux de défaillance est constant et indépendant du temps (défauts aléatoires, loi exponentielle)
- pour  $\beta$  > 1, le taux de défaillance est croissant avec le temps (phénomène d'usure, par exemple pour des roulements, moteurs...)

jeunesse

periode util

vieillesse

53

# Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

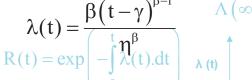
## Application aux principales lois de probabilité

#### La loi de Weibull

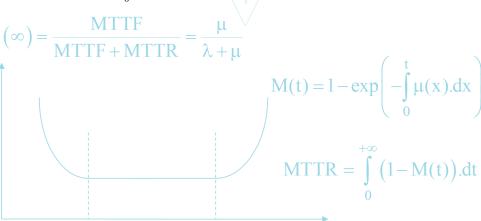
$$R(t) = 1 - F(t) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{t - \gamma}{\eta}\right)^{\beta}\right) = \exp\left(-\left(\frac{t - \gamma}{\eta}\right)^{\beta}\right)$$

jeunesse

MTTF = 
$$\eta + \eta \Gamma (1 + \frac{1}{\beta})$$
  $\Gamma(a) = \int_{0}^{\infty} t^{(a-1)} e^{-t} dt$ 



$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$



vicillosos 4

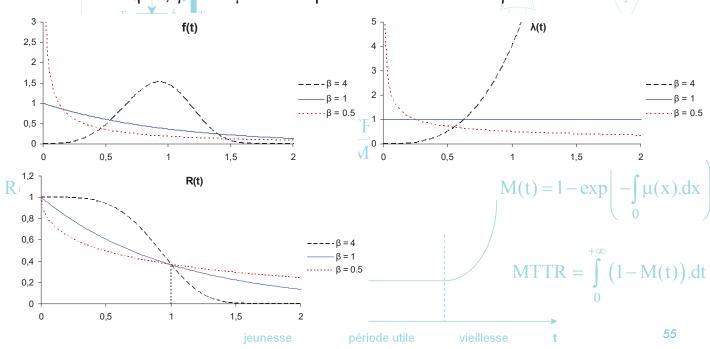
# Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## Application aux principales lois de probabilité

#### La loi de Weibull



loi de Weibull  $\eta=1$ ,  $\gamma=0$  et  $\mu=0.5$  et plusieurs valeurs de  $\beta$ 



# INP Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## **Exercice**

Soit un composant dont sa durée de vie (durée de fonctionnement avant la défaillance) est distribuée suivant une loi exponentielle de taux de défaillance  $\lambda = 10^{-6} \text{ h}^{-1}$ .

Calculer le MTTF de ce composant et la valeur de la fiabilité R(MTTF). Qu'en concluez-vous ?

Un autre composant ayant la même fonctionnalité à son taux de défaillance  $\lambda' = 10^{-7} \text{ h}^{-1}$ . Comparez les valeurs de la fiabilité de ces composants aux instants  $t_1 = 10^4 \text{ h}$  et  $t_2 = 10^6 \text{ h}$ .  $M(t) = 1 - \exp\left(-\frac{\mu(x) \cdot dx}{\mu(x) \cdot dx}\right)$ 

Quelle est la probabilité de défaillance de ces composants à l'instant t = 10<sup>4</sup> h?

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

$$MTTR = \int_{0}^{\infty} (1 - M(t)).dt$$
ieunesse période utile vieillesse t 56

# INP Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité



Soit un composant dont sa durée de vie (durée de fonctionnement avant la défaillance) est distribuée suivant une loi de Weibull de paramètres  $\eta=1.5*10^4h$ ,  $\gamma=0$  et  $\beta=2$ .

- 1. Déterminer et représenter graphiquement l'évolution de la fiabilité et du taux de défaillance de ce composant. Déterminer et représenter graphiquement l'évolution de la probabilité de défaillance de ce composant.
- 2. Le processus de réparation mis en place par l'entreprise est caractérisé par un taux de réparation  $\mu = 4*10^{-2} hr^{1}$  Déterminer son MTTR. Calculer sa maintenabilité  $M_{10}$  et  $M_{500}$ . Représenter graphiquement l'évolution de la maintenabilité de ce composant.
- 3. Le processus de réparation est externalisé par l'entreprise, et dans ce cas il est caractérisé par une loi de Weibull de paramètres  $\eta = 6.0*10^3 h$ ,  $\gamma = 0$  et  $\beta = 1.8$ . Déterminer et représenter graphiquement l'évolution de la maintenabilité et du taux de réparation du composant dans ce cas.

Comparer les deux politiques de maintenance.

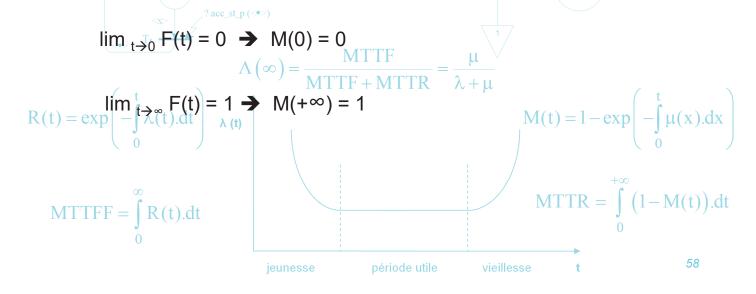
# 

## Fonction de répartition [1]

La variable aléatoire est, dans le cas de la maintenabilité, le temps Titotal de réparation si l'entité est défaillante à t = 0.

$$F(t) = P[T \le t] = M(t)$$

Il y a identité entre la fonction de répartition et la maintenabilité.



# INP Ensecrandeurs caractéristiques de la maintenabilité

## Densité de probabilité ou fonction de distribution

D'après la norme CEL50 (191) :

$$w(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t}$$

soit pour une fonction de répartition continue :



$$w(t)dt = P[t < T \le t + dt]$$

$$MTTF = \int_{0}^{+\infty} R(t).dt$$

$$jeunesse \qquad période utile \qquad vieillesse \qquad t \qquad 59$$

# Ense Ense Ense En la maintenabilité

## Taux de réparation dem\_op\_p (<x>)

μ(t)dt est la probabilité pour que l'entité soit réparée entre t et t + dt sachant qu'elle est encore en panne à l'instant t.

C'est la limite si elle existe, du quotient de la probabilité conditionnelle pour que l'instant T de réparation d'une entité soit compris entre t et t + ∆t, par la durée de l'intervalle \Delta t lorsque celui-ci tend vers zéro, sachant que l'entité est restée en panne sur l'intervalle [0,t] (cf. à la norme CEI 50(191)).

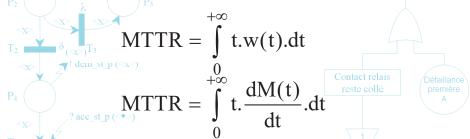
$$\mu(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} P[t < T \le t + \Delta t / T > t]$$

$$par une \ d\'{e}monstration \ identique \ \grave{a} \ celle \ du \ taux \ de \ d\'{e}faillance : \\ R(t) = exp \left( -\int_{0}^{t} \mu(t) \lambda(t) \right) \mu(t) = \frac{dt}{1-M(t)}$$
 
$$\mu(t) = \frac{dt}{1-M(t)}$$
 
$$\mu(t) = 0$$
 
$$\mu(t)$$

## 

#### MTTR et maintenabilité (SE)

Le MTTR étant l'espérance mathématique de la variable aléatoire de densité de probabilité w, on a donc :



L'intégration par partie et les conditions aux limites donnent :

$$R(t) = \exp\left(-\int_{0}^{t} \lambda(t).dt\right) \quad \lambda(t) \quad MTTR = \int_{0}^{t} (1 - M(t)).dt \quad M(t) = 1 - \exp\left(-\int_{0}^{t} \mu(x).dx\right)$$

Dans le cas d'une distribution exponentielle, le taux de réparation  $\mu$  est constant et le MTTR est égal à l'inverse de  $\mu$ .

MTTFF = 
$$\int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

$$MTTR = \frac{1}{\mu}$$

$$\text{jeunesse}$$

$$\text{période utile}$$

$$\text{vieillesse}$$

$$\text{month of the set egal a l'inverse de  $\mu$ .
$$MTTR = \int_{0}^{+\infty} (1 - M(t)).dt$$$$

# INP Ensem

Soit:

## Disponibilité d'une entité

Surchauffe du fil

## Disponibilité asymptotique

- lorsque l'entité n'est pas réparable, sa disponibilité est égale à sa fiabilité
- lorsque l'entité est réparable, on peut écrire que la disponibilité d'une entité à l'instant t + dt est égale à la probabilité pour que l'entité soit disponible à t et qu'elle ne retombe pas en panne entre t et t + dt ou que l'entité, étant en panne à l'instant t, soit réparée à l'instant t + dt : Contact relais permière

Les deux cas étant complètements indépendants, cette probabilité est la somme des probabilités de chaque cas :  $M(t) = 1 - \exp\left[-\int \mu(x).dx\right]$ 

A (t + dt) = P[E disponible à t et non défaillante sur [t, t + dt]]

HATTFF = 
$$\int_{0}^{\infty} R(t) dt$$
en panne à t et réparée sur [t, t + dt]] = 
$$\int_{0}^{\infty} (1 - M(t)) dt$$

# INP Ensem

## Disponibilité d'une entité

## Disponibilité asymptotique

La disponibilité étant une probabilité à priori :

P[E disponible à t et non défaillante sur ]t, t + dt]]

E P[E disponible à t] . P[E non défaillante sur [t, t + dt]].

On écrit la même chose pour le deuxième terme. Contact relais reste collé



Si on se place dans le cas de distributions exponentielles où les taux de défaillance et de réparation sont constants (respectivement  $\lambda$  et  $\mu$ ) :

MTTF + MTTR  $\lambda + \mu$ P[E | disponible | à t] = A(t)P[non défaillante sur [t, t+dt]]  $= 1-\lambda.dt$  $P[E] = \exp \left[ -\frac{\int_{0}^{t} \lambda(t) dt}{\int_{0}^{t} \rho(t) dt} \right] = 1-A(t) P[défaillante sur [t, t+dt]] = \lambda.dt$ 

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

$$MTTR = \int_{0}^{+\infty} (1 - M(t)).dt$$

# INP Ensem

## Disponibilité d'une entité



## Disponibilité asymptotique

A 
$$(t + dt) = A(t).(1 - \lambda dt) + (1 - A(t)).\mu dt$$

jeunesse

$$A(t + dt) = A(t) - (\lambda + \mu) A(t) dt + \mu dt$$

 $\frac{dA(t)}{dt} = \mu^{-\delta} (\lambda^{T} + \mu) A(t)$  équation différentielle dont la solution est :

$$A(t) = \frac{\mu}{\sum_{t=0}^{p_{t}} \lambda + \mu} + \sum_{t=0}^{p_{t}} \frac{\lambda A(0) - \mu(1 - A(0))}{\lambda + \mu} \cdot e^{-(\lambda + \mu)t}$$

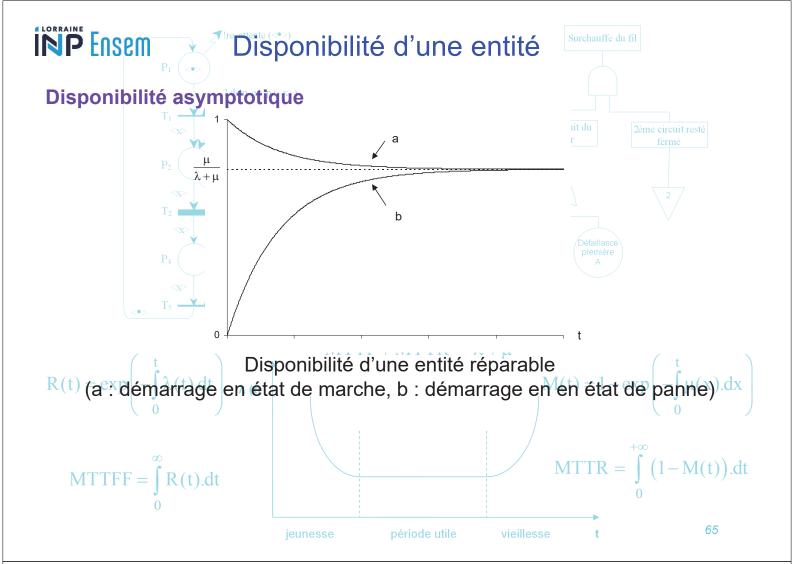
Supposons que A(0) = 1 (l'entité est disponible à l'instant t = 0):

$$R(t) = \exp\left[A\left(t\right)^{\frac{t}{2}}\right] \underbrace{A\left(t\right)}^{t} \underbrace{A\left(t\right)}^{\frac{t}{2}}\underbrace{A\left(t$$

$$M(t) = 1 - \exp\left(-\int_{0}^{t} \mu(x).dx\right)$$

Supposons que A (0) = 0 (l'entité est en panne à l'instant t = 0):  $\int_{0}^{+\infty} (1 - M(t)) dt$   $A(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} - \frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t}$   $\int_{0}^{+\infty} (1 - M(t)) dt$ 

$$A(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} - \frac{\mu}{\lambda + \mu} \cdot e^{-(\lambda + \mu)}$$





## Disponibilité d'une entité

Disponibilité asymptotique

Lorsque  $t \rightarrow \infty$ , les deux équations tendent vers  $\frac{\mu}{\lambda + \mu}$  Court-circuit du moteur

$$A\left( \underset{P_{4}}{\overset{\mu}{\sum}} \right) = \underbrace{\frac{1}{MTTR}}_{P_{4}} = \underbrace{\frac{1}{MTTF}}_{MTTF} + \underbrace{\frac{1}{MTTR}}_{TTF} = \underbrace{\frac{\lambda + \mu}{MTTF}}_{Contact \ reste \ collé}$$

La disponibilité asymptotique est égale à la proportion du temps pendant lequel l'entité est en état de fonctionnement.

On a de même : 
$$1 - A(\infty) = \frac{\lambda TTF + MTMTTR + \mu}{\lambda + \mu}$$

$$R(t) = \exp(-\int_{0}^{t} \lambda(t).dt) + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{\lambda}{MTTF + MTTR}$$

$$M(t) = 1 - \exp(-\int_{0}^{t} \mu(x).dx)$$

$$MTTF = \int_{0}^{+\infty} R(t).dt$$

$$MTTF = \int_{0}^{+\infty} (1 - M(t)).dt$$

$$\text{jeunesse}$$

$$\text{période utile}$$

$$\text{vieillesse}$$

$$\text{follows:}$$

# Ensem Grandeurs caractéristiques de la fiabilité

## **Exercice**

Soit un composant dont sa durée de vie (durée de fonctionnement avant la défaillance est distribuée suivant une loi exponentielle de taux de défaillance  $\lambda = 10^{-6} \text{ h}^{-1}$ .

Le processus de réparation mis en place par l'entreprise est caractérisé par un taux de réparation  $\mu = 4*10^{-2} \text{ h}^{-1}$ .

- 1. Déterminer la disponibilité asymptotique de ce composant.
- 2. Représenter graphiquement l'évolution de sa disponibilité en fonction du temps sous l'hypothèse suivante. + MTTR  $\lambda + \mu$
- R(t) = exa. Le composant est disponible à l'instant initial  $M(t) = 1 exp \int_0^t \mu(x) dx$  b. Le composant est indisponible à l'instant initial.

$$MTTFF = \int_{0}^{\infty} R(t).dt$$

MTTFF = | R(t).dt



Markov ProcessesM(t)).dt

automates stochastiques

(BDMP)

leftybrides (ASH)

# INP Ensem Sûrete de fonctionnement des systèmes

#### Analyse qualitative Analyse (évaluation) quantitative Systèmes statiques\* Systèmes dynamiques\* Méthodes de l'espace Méthodes analyse préliminaire combinatoires des risques, APR • chaînes de Markov et diagrammes de analyse des modes leurs extensions fiabilité, RBD F de défaillance, de leurs effets (et de leur • arbres des MTTR Statecharts stochastiques criticité) AMDE(C) défaillances réseaux de Petri · méthode HAZOP stochastiques et arbres d'événements (hazard and) leurs extensions fonction de structure operability study) **Boolean Driven** réseaux de fiabilité

\*D.p.d.v. fiabiliste, c.à.d. la structure fiabiliste du système ne change pas

(statique) ou elle évolue pendant sa

durée de vie (dynamique).